

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
08:00-10:00		CM2.1 : Technologie des assemblages de puissance Laurent Dupont (SATIE) Marie-Laure Locatelli (LAPLACE)	CM 2.3 : Estimation de la durée de vie des composants de puissance Zoubir Khatir (SATIE)	CM2.3 : Technologie et vieillissement des composants passifs Maawad Makdessi (YAGEO Group)	CM4.2 : sécurisation des convertisseurs de puissance Frédéric Richardeau (Laplace)
30'		Pause café			
10:30-12:00	Arrivée sur le site Accueil et présentation de l'école	CM3.1: mécanismes d'endommagement des CSP Mounira Bouarroudj (SATIE)	TD2.3 : Estimation de la durée de vie des composants de puissance Zoubir Khatir (SATIE)	CM4.1: Diagnostic orienté fiabilité en EdP Pascal Venet (Ampère) Julio Brandelero (STmicroelectronics)	CM4.3 : Reconfiguration des convertisseurs de puissance Arnaud Gaillard (FEMTO)
12:00-13h30		Pause déjeuner			
13:30-14:30	CM1.1 : Méthodes usuelles pour déterminer les taux de défaillance des composants Pascal Venet (Ampère)	CM3.2: Mécanismes de défaillance des grand gap David Trémouilles (LAAS)	CM2.2 : Technologie et vieillissement des composants magnétiques Maawad Makdessi (YAGEO Group)	TR1.1 : Point de vue multidomaines des industriels, aujourd'hui et demain ? Michel Piton (ALSTOM) Julio Brandelero (MITSUBISHI ELECTRIC) Stéphane AZZOPARDI(Safran) Intervenant secteur Automobile (?)	Bilan et évaluation de l'école
15:00-16:30	TD1.2 : Méthodes usuelles pour déterminer les taux de défaillance des composants (approche industrielle) Loïc Théolier (IMS)	CM3.3 : Méthodes et outils d'analyse de défaillance Gérald Guibaud (Thales)	Atelier: Soutenabilité des convertisseurs de puissance		
30'		Pause café			Départ
16:30-17:30	Atelier doctorants : Mon poster en 180''	CM3.3 : Méthodes d'analyse de défaillance Loïc Théolier (IMS)	Activité culturelle		
17:30-18:00	Evaluation	Evaluation		Evaluation	